

Angewandte Oberflächenanalyse mit SIMS Sekundär-Ionen- Massenspektrometrie, AES Aufer-Elektronen-Spektrometrie, XPS, Röntgen-Photoelektronen-Spektrometrie



[Angewandte Oberflächenanalyse mit SIMS Sekundär-Ionen- Massenspektrometrie, AES
Aufer-Elektronen-Spektrometrie, XPS,
Röntgen-Photoelektronen-Spektrometrie_ 下载链接1](#)

著者:M. Grasserbauer

出版者:Springer

出版时间:1986-6-13

装帧:Hardcover

isbn:9783540150503

作者介绍:

目录:

[Angewandte Oberflächenanalyse mit SIMS Sekundär-Ionen- Massenspektrometrie, AES
Aufer-Elektronen-Spektrometrie, XPS,
Röntgen-Photoelektronen-Spektrometrie_ 下载链接1](#)

标签

评论

[Angewandte Oberflächenanalyse mit SIMS Sekundär-Ionen- Massenspektrometrie, AES
Aufer-Elektronen-Spektrometrie, XPS,
Röntgen-Photoelektronen-Spektrometrie_ 下载链接1](#)

书评

[Angewandte Oberflächenanalyse mit SIMS Sekundär-Ionen- Massenspektrometrie, AES
Aufer-Elektronen-Spektrometrie, XPS,
Röntgen-Photoelektronen-Spektrometrie_ 下载链接1](#)